

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Тодуа Павел Андреевич
2	Дата рождения (полная)	10 июня 1941
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук (01.04.10)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119361, г. Москва, ул. Озерная, 46, vniofi@vniofi.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Оптико-Физических Измерений
	Ведомственная принадлежность организации	РОССТАНДАРТ
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	
	Должность	ведущий научный сотрудник
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vasil'ev A.L., Mikhutkin A.A., Mityukhlyayev V.B., Todua P.A., Filippov M.N. Evaluation of the component of bias of X-ray microanalysis related to surface relief of the specimen. inorganic materials, 53 (14) C.1463-1466 (2017) 2. Дарзбек С.А., Карабанов Д.А., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н. Измерение высоты элементов нанорельефа поверхности методом трёхмерной реконструкции в растровом электронном микроскопе. Измерительная Техника, 3 С.15-18 (2017) 3. Гавриленко В.П., Кузин А.Ю., Митюхляев В.Б., Степович М.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н., Карабанов Д.А. Образование окисной пленки на поверхности кремниевой рельефной структуры в процессе плазменной очистки. Измерительная Техника, 8 С.71-72 (2015) 4. Бокарев В.П., Горнев Е.С., Красников Г.Я., Тодуа П.А. Анизотропия работы выхода электронов и поверхностная энергия металлов. Электронная Техника. Серия 3: Микроэлектроника, 1 (156) С.18-20 (2014) 5. Kuzin A.Y., Mityukhlyayev V.B., Todua P.A., Filippov M.N., Stepovich M.A. Thermal effects during low-voltage electron-probe X-ray spectral microanalysis with nanometer localization. Measurement Techniques, 59 (10) C.1061-1064 (2017) 6. Kuzin A.Y., Mityukhlyayev V.B., Todua P.A., Filippov M.N. Change in the chemical composition of an analyzed object during low-voltage electron probe X-ray spectral microanalysis. Measurement Techniques, 59 (11). C.1234–1237 (2017) 7. Kirtaev R.V., Maslov V.G., Mityukhlyayev V.B., Todua P.A., Filippov M.N., Kuzin A.Y. Calibration of scanning electron microscopes over a wide range of magnifications. Measurement Techniques, 59 (12) C.1245-1249 (2017) 8. Дарзбек С.А., Митюхляев В.Б., Тодуа П.А., Филиппов М.Н. Электронно-зондовый рентгеноспектральный анализ нанопленок при наклонном падении пучка электронов. Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 83 (9) С.5-9 (2017) 	

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты